(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. Februar 2005 (10.02.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/012933 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: 31/28, H03M 1/10
- G01R 35/00,
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001487
- (22) Internationales Anmeldedatum:

8. Juli 2004 (08.07.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 35 164.7

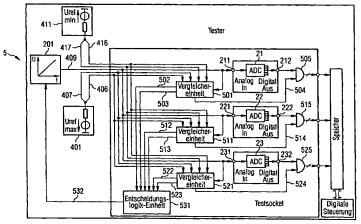
30. Juli 2003 (30.07.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MATTES, Heinz [DE/DE]; Otto-Wels-Str. 7, 81739 München (DE). SATTLER, Sebastian [DE/DE]; Severinstr. 5, 81541 München (DE).
- (74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; c/o Kanzlei Schweiger & Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für iede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: DEVICE AND METHOD FOR TESTING INTEGRATED CIRCUITS
- (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TESTEN VON INTEGRIERTEN SCHALTKREISEN



531 ... DECISION LOGIC UNIT 501, 511, 521 ... COMPARATOR UNIT DIGITAL AUS » DIGITAL OUT TESTSOCKEL » TEST SOCKET SPEICHER » MEMORY DIGITALE STEUERUNG » DIGITAL CONTROL SYSTEM

(57) Abstract: The invention relates to a test device comprising a precision signal generator (201) which is used to generate a test signal and is connected, by means of a connection line (409), to an input contact (211; 221; 231) used for connection to the input of an integrated circuit, in addition to at least one reference signal generator (401, 411) for producing a reference signal. Furthermore, at least one comparator unit (501, 511, 521) is provided for each input contact (211, 221, 231), said comparator having a test mode in which the test signal is compared with the reference signal. The precision signal generator (201) is switched off by the comparator unit (501, 511, 521) when the test signal exceeds or falls short of the reference signal.

(57) Zusammenfassung: Die erfindungsgemäße Testvorrichtung umfasst einen Präzisionssignalgenerator (201) zum Generieren eines Testsignals, der über eine Anschlussleitung (409) mit einem zum Anschluss an einen Eingang eines integrierten Schaltkreis bestimmten Eingangskontakt (211; 221; 231) verbunden ist, und wenigstens einen Referenzsignalgenerator (401, 411) zum

WO 2005/012933 A1

TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.